- 1. 此機台開放等級為 B2 級,使用者經訓練且通過考核後可自行操作。
- 2. 申請使用者須先通過 TRACK 考核滿 1 個月後,才可以申請考核 I-line stepper (許進財先生 ext:7648; mail: cthsu@narlabs.org.tw), 一旦 TRACK 被停權,則同時取消 I-line stepper 使用權。
- 3. 為維持委託代工出貨進度順暢,於上班時段(上午8:00至下午6:00) NDL 員工有優先使用權。如欲在上班時段使用機台,必須先徵求現場 operator 同意之後,方可使用;若現場無 operator,可先行使用,但於使用中若 operator 出現且欲使用機台,operator 有權要求使用者中止使用。
- 每次使用須詳實填寫機台使用紀錄表,如有闕漏不實者,將視情節依 TSRI 規定議處。
- 5. 關於曝光後線寬的量測,由使用者自行操作 LO6 CD SEM 量測。
- 6. 曝光檔名與內容請自行牢記,TSRI不負記憶檔名與內容之責任。
- 7. 為活化硬碟空間,機台每年 2 月及 8 月進行曝光檔案清理,使用者請於 1 月底及 7 月底前將欲保留的檔案名稱列表繳交機台負責人,若因未繳交或是表列遺漏以致檔案遭刪除,使用者請自負責任,不得異議。
- 8. 曝多層圖形,如果第一層為離子佈值阻擋層,請另行作零層曝光 (ILINEMARK-CO.JOB)與蝕刻(蝕刻深度大於100 nm)。
- 9. 標準製程基材為: 單面拋光 6 吋單平邊矽晶圓, 平邊長度 57.5 mm,厚度 675μm (晶圓規格需與 NDL 規格相同),非標準製程基材請與工程師探討。
- 10. 標準製程光阻劑為 Sumitomo PFI38A5 阻劑(厚度 850 nm)、PFI89 阻劑(厚度 2100 nm)與 PFI245 阻劑(厚度 420 nm)。
- 11. 本機台最小解析為 0.35 um L/S pattern、0.3um Line pattern 與 0.4um hole pattern,若有其他特殊需求請洽工程師。
- 12. 機台劑量設定範圍: 500~4000 J/M², focus 設定範圍: +3~-3 um. 未經許可, 不可私自設定超過規定之值,造成機台有損傷之虞。
- 13. 嚴禁使用其他基材或阻劑,如欲使用其他基材或阻劑,須提出相關之書面說明,並經機台負責人核准後,方可使用。
- 14. 本機有關破片、4 吋與 2 吋等曝光製程,請洽工程師。